## **RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION**

Publication number: JP2001188347 (A) Publication date: 2001-07-10

Inventor(s): ISHII HIROYUKI; DOUKI KATSUJI; KAJITA TORU; SHIMOKAWA TSUTOMU

Applicant(s): JSR CORP

Classification:

- international: G03F7/039; C08K5/00; C08L33/14; C08L45/00; H01L21/027; G03F7/039;

C08K5/00; C08L33/00; C08L45/00; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/039; C08K5/00;

C08L33/14; C08L45/00; H01L21/027

- European:

Application number: JP20000137757 20000510

Priority number(s): JP20000137757 20000510; JP19990296028 19991018

## Abstract of JP 2001188347 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation sensitive resin composition excellent in shelf stability, having high transparency to radiation and excellent also in basic physical properties as a resist such as dry etching resistance, sensitivity, resolution and pattern shape. SOLUTION: The radiation sensitive resin composition contains (A) an acid- dissociable group-containing resin having repeating units derived from a (meth) acrylic acid derivative having an alicyclic skeleton containing an oxygen- or nitrogen-containing polar group typified by 3-hydroxy-1-adamantyl (meth)acrylate or 3-(8'cyanotetracyclo[4.4.0.12,5.17,10]dodecyl (meth)acrulate and repeating units derived from another (meth)acrylic acid derivative having an alicyclic skeleton typified by 2-methyl-2-adamantyl (meth) acrylate and convertible to an alkali- soluble resin when the acid-dissociable group is dissociated and (B); a radiation sensitive acid generating agent.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-188347 (P2001-188347A)

(43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

			_				
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコート <sup>*</sup> (参考)	
G03F	7/039	601	G 0 3 F	7/039	601	$2\mathrm{H}025$	
C08K	5/00		C 0 8 K	5/00		4 J 0 0 2	
C08L	33/14		C08L 3	33/14			
	45/00		4	15/00			
H01L	21/027		H01L 2	21/30	502I	3	
			審査請求	未請求	請求項の数3	OL (全 36 頁)	
(21)出願番号		特驥2000-137757(P2000-13	7757) (71)出願人	000004178			
				ジェイコ	にスアール株式会	社	
(22)出願日		平成12年5月10日(2000.5.10)		東京都中	中央区築地2丁目	月11 <b>番</b> 24号	
			(72)発明者	石井 質	之		
(31)優先権主	張番号	特願平11-296028		東京都中	中央区築地二丁目	111番24号 ジェイ	
(32)優先日		平成11年10月18日(1999.10.18	()	エスアー	ール株式会社内		
(33)優先権主	張国	日本(JP)	(72)発明者	銅木 プ	艺次		
				東京都中	中央区築地二丁目	11番24号 ジェイ	
				エスアー	ール株式会社内		
			(74)代理人	1001009	85		
				弁理士	福沢 俊明		
						最終頁に続く	

## (54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

# (57)【要約】

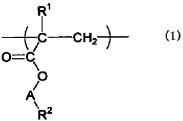
【課題】 組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)3ーヒドロキシー1-アダマンチル(メタ)アクリレート、3ー(8'ーシアノテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデシル)(メタ)アクリレート等で代表される酸素含有極性基または窒素含有極性基を含有する脂環式骨格を有する(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰返し単位と、2-メチルー2-アダマンチル(メタ)アクリレート等で代表される脂環式骨格を有する他の(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰返し単位とを有する酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有する。

## 【特許請求の範囲】

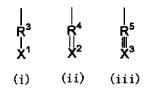
【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される繰返し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

# 【化1】



「一般式(1)において、R<sup>1</sup>は水素原子、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、Aは単結合または主鎖炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示し、R<sup>2</sup>は下記式(i)(但し、R<sup>3</sup>は炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基を示し、X<sup>1</sup>は1価の酸素含有極性基または1価の窒素含有極性基を示す。)、式(ii)(但し、R<sup>4</sup>は炭素数4~20の3価の脂環式炭化水素基を示し、X<sup>2</sup>は2価の酸素含有極性基または2価の窒素含有極性基を示す。)または式(ii)(但し、R<sup>5</sup>は炭素数4~20の4価の脂環式炭化水素基を示し、X<sup>3</sup>は3価の酸素

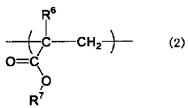
## 【化2】



含有極性基または3価の窒素含有極性基を示す。)

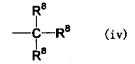
で表される基を示す。〕

# 【化3】



〔一般式(2)において、 $R^6$  は水素原子、炭素数  $1\sim$  4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数  $1\sim$ 4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数  $1\sim$ 4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、 $R^7$  は炭素数  $4\sim$  20の 1 価の脂環式炭化水素基または下記式(iv)

## 【化4】

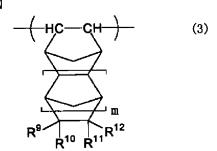


(但し、各 $R^8$  は相互に独立に炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 $4\sim2$ 0の1価の脂環式炭化水素基を示し、かつ少なくとも1つの $R^8$  が炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基であるか、あるいは何れか2つの $R^8$  が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim2$ 0の2価の脂環式炭化水素基を形成し、残りの $R^8$  が炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。)で表される基を示す。〕

【請求項2】 (A)成分における一般式(1)で表される繰返し単位中のR®、R4 およびR® の各脂環式炭化水素基並びに一般式(2)で表される繰返し単位中のR®の1価の脂環式炭化水素基およびR®の1価もしくは2価の脂環式炭化水素基が相互に独立に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基であることを特徴とする請求項1記載の感放射性樹脂組成物。

【請求項3】 (A)成分が一般式(1)で表される繰返し単位、一般式(2)で表される繰返し単位および下記一般式(3)で表される繰返し単位を有することを特徴とする請求項1または請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。

# 【化5】



[一般式(3)において、R<sup>8</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>11</sup>およびR<sup>12</sup> は相互に独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは非置換の炭素数 1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の直鎖状もしくは分岐状の炭素数 1~6のアルコキシル基または炭素数 2~20の酸解離性基を示し、mは0、1または2の整数である。〕

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如

き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型 レジストとして好適に使用することができる感放射線性 樹脂組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近では0.20μm以下のレベルでの微細加工技術が必 要になるとされている。従来のリソグラフィープロセス においては、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用 いられているが、近紫外線ではサブクオーターミクロン 以下のレベルでの微細加工が極めて困難であると言われ ている。そこで、0.20μm以下のレベルにおける微 細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利 用が検討されている。このような短波長の放射線として は、例えば、水銀灯の輝線スペクトルやエキシマレーザ ーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げること ができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレーザ - (波長248nm)あるいはArFエキシマレーザー (波長193nm)が注目されている。前記短波長の放 射線に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官 能基を有する成分と放射線の照射(以下、「露光」とい う。)により酸を発生する感放射線性酸発生剤との間に おける化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増 幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案されて いる。このような化学増幅型感放射線性組成物として は、例えば、特公平2-27660号公報に、カルボン 酸のセーブチルエステル基またはフェノールのセーブチ ルカーボナート基を有する重合体と感放射線性酸発生剤 とを含有する組成物が提案されている。この組成物は、 露光により発生した酸の作用により、重合体中に存在す る
セーブチルエステル基や
セーブチルカーボナート基が 解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノー ル性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結 果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性 となる現象を利用したものである。ところで、従来の化 学増幅型感放射線性組成物の多くは、フェノール系樹脂 をベースにするものであるが、このような樹脂の場合、 放射線として遠紫外線を使用する場合、樹脂中の芳香族 環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠 紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できない という欠点があり、そのため露光量がレジスト被膜の上 層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジス トパターンが上部が細く下部にいくほど太い台形状にな ってしまい、十分な解像度が得られないなどの問題があ った。また現像後のレジストパターンが台形状となった 場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込みな どを行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題とな っていた。しかもレジストパターン上部の形状が矩形で ないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が 速くなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる

問題もあった。

【0003】一方、レジストパターンの形状は、レジス ト被膜の放射線透過率を高めることにより改善すること ができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表さ れる(メタ)アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対して も透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好まし い樹脂であり、例えば特開平4-226461号公報に は、メタクリレート系樹脂を使用した化学増幅型感放射 線性組成物が提案されている。しかしながら、この組成 物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族 環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという 欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行う ことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッ チング耐性とを兼ね備えたもとのは言えない。また、化 学増幅型感放射線性組成物からなるレジストについて、 放射線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチン グ耐性を改善する方策の一つとして、組成物中の樹脂成 分に、芳香族環に代えて脂環族環を導入する方法が知ら れており、例えば特開平7-234511号公報には、 脂環族環を有する (メタ) アクリレート系樹脂を使用し た化学増幅型感放射線性組成物が提案されている。しか しながら、従来の脂環族環を導入した化学増幅型感放射 線性組成物では、酸解離性官能基として、酸により比較 的解離し易い基 (例えば、テトラヒドロピラニル基等の アセタール系官能基) あるいは酸により比較的解離し難 い基(例えば、セーブチルエステル基やセーブチルカー ボネート基等のt-ブチル系官能基)が一般に用いられ ており、前者の酸解離性官能基を有する樹脂成分を用い る場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状 は良好であるが、組成物としての保存安定性に難点があ り、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分を用い る場合は、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの 基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという 欠点がある。しかも、これらの組成物は、樹脂成分が脂 環族環を有するため、樹脂自体の疎水性が非常に高くな り、基板接着性についても問題があった。そこで、放射 線に対する透明性が高く、しかも保存安定性、ドライエ ッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等に優れ、 また基板接着性も良好な化学増幅型感放射線性組成物の 開発が求められている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザーに代表される遠紫外線、に感応する化学増幅型レジストとして、組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

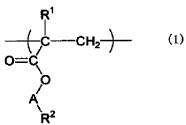
## [0005]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、(A)下記一般式(1)で表される繰返し単位

- (1)および下記一般式(2)で表される繰返し単位
- (II)を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の 酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離した ときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線 性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂 組成物。

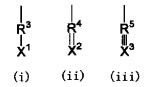
[0006]

【化6】



【0007】〔一般式(1)において、 $R^1$  は水素原子、炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、Aは単結合または主鎖炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示し、 $R^2$ は下記式(i)(但し、 $R^3$  は炭素数 $4\sim2$ 0の2価の脂環式炭化水素基を示し、 $X^1$  は1 価の酸素含有極性基または1 価の窒素含有極性基を示す。)、式(ii)(但し、 $R^4$  は炭素数 $4\sim2$ 0の3価の脂環式炭化水素基を示し、 $X^2$  は2 価の酸素含有極性基または2 価の窒素含有極性基を示す。)または式(iii)(但し、 $R^5$  は炭素数 $4\sim2$ 0の4価の脂環式炭化水素基を示し、 $X^3$ は3価の酸素含有極性基または3価の窒素含有極性基を示す。)

【0008】 【化7】



【0009】で表される基を示す。〕

[0010]

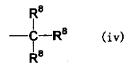
【化8】

【0011】〔一般式(2)において、R6 は水素原

子、炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、 $R^7$ は炭素数  $4\sim2$ 0の1価の脂環式炭化水素基または下記式(iv)

[0012]

【化9】



【0013】(但し、各 $R^8$  は相互に独立に炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 $4\sim 20$ の1 価の脂環式炭化水素基を示し、かつ少なくとも1つの $R^8$  が炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基であるか、あるいは何れか2つの $R^8$  が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim 20$ の2 価の脂環式炭化水素基を形成し、残りの $R^8$  が炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。)で表される基を示す。〕により達成される

【0014】以下、本発明を詳細に説明する。

# (A)成分

本発明における(A)成分は、前記一般式(1)で表される繰返し単位(以下、「繰返し単位(1)」という。)および前記一般式(2)で表される繰返し単位(以下、「繰返し単位(2)」という。)」を必須の構成単位とするアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂(以下、「樹脂(A)」という。)からなる。樹脂(A)における繰返し単位(1)などが緩慢し開始(2)は、それたのカルボン酸

- (1)および繰返し単位(2)は、それらのカルボン酸エステル基が酸解離性を有し、後述する酸発生剤(B)から発生した酸の作用により解離してカルボキシル基を形成することにより、樹脂(A)をアルカリ可溶性とする作用を示す単位である。本発明においては、樹脂
- (A)を含有することにより、レジストとして、特に放射線に対する透明性およびドライエッチング耐性が優れた感放射線性樹脂組成物を得ることができる。

【0015】一般式(1)において、R1の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2ーメチルプロピル基、1ーメチルプロピル基、tーブチル基等を挙げることができる。また、R1の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、2ーメチルプロポキシ基、1ーメチルプロポキシ基、tーブトキシ基等を挙げることができる。また、R1の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシ

アルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、1ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、3ーヒドロキシプロピル基、1ーヒドロキシブチル基、2ーヒドロキシブチル基、3ーヒドロキシブチル基、4ーヒドロキシブチル基等を挙げることができる。これらのR<sup>1</sup>のうち、特に、水素原子、メチル基、ヒドロキシメチル基等が好ましい。

【0016】一般式(1)において、Aの主鎖炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、1-メチルー1,1-エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基等を挙げることができる。これらのアルキレン基のうち、特に、メチレン基が好ましい。

【0017】一般式(1)において、R³、R⁴ および R5 の炭素数4~20の各脂環式炭化水素基としては、 例えば、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシ クロデカン骨格、テトラシクロドデカン骨格や、シクロ ブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプ タン、シクロオクタン等のシクロアルカン骨格を有する 基;これらの基を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2ーメチ ルプロピル基、1-メチルプロピル基、セーブチル基等 の炭素数1~10の直鎖状、分岐状または環状のアルキ ル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等の脂環 式骨格を有する基等を挙げることができる。これらの脂 環式炭化水素基のうち、アダマンタン骨格、ノルボルナ ン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデ カン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基や、こ れらの基を前記直鎖状、分岐状または環状のアルキル基 で置換した基等が好ましく、特に、アダマンタン骨格、 ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラ シクロドデカン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有す る基や、これらの基をメチル基あるいはエチル基で置換 した基等が好ましい。

【0018】一般式(1)において、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>および X<sup>3</sup>のうち、酸素含有極性基としては、例えば、ヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=0基);アルド基(即ち、-CHO基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロ

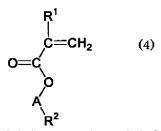
キシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、2ーメチルプロポキシ基、1ーメチルプロポキシ基、tーブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基等を挙げることができ、また窒素含有極性基としては、例えば、シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロピル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等を挙げることができる。これらの酸素含有極性基および窒素含有極性基のうち、特に、ヒドロキシル基、オキシ基、アルド基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

【 0 0 1 9 】 繰返し単位 (1) を与える単量体として は、例えば、下記一般式 (4) で表される (メタ) アク リル酸誘導体 (以下「 (メタ) アクリル酸誘導体

(4)」という。)を挙げることができる。

[0020]

【化10】



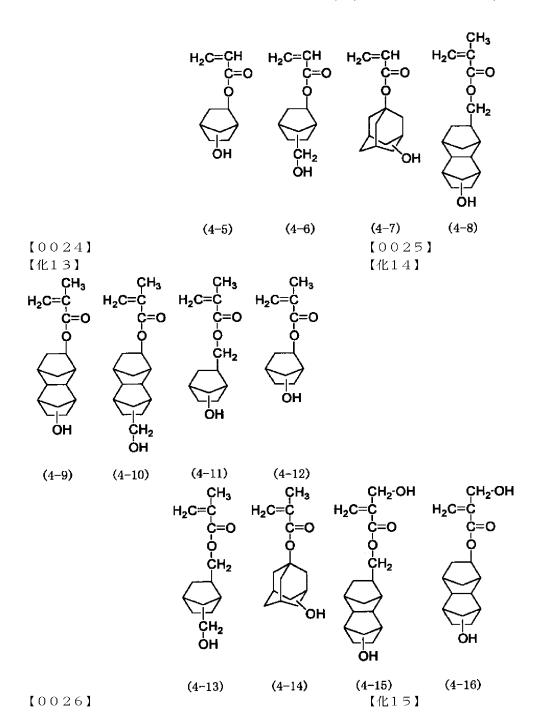
〔一般式(4)において、 $R^1$  、 $R^2$  およびAは一般式(1)のそれぞれ $R^1$  、 $R^2$  およびAと同義である。) 【0021】(メタ)アクリル酸誘導体(4)の具体例としては、下記式(4-1)~(4-127)で表される化合物等を挙げることができる。

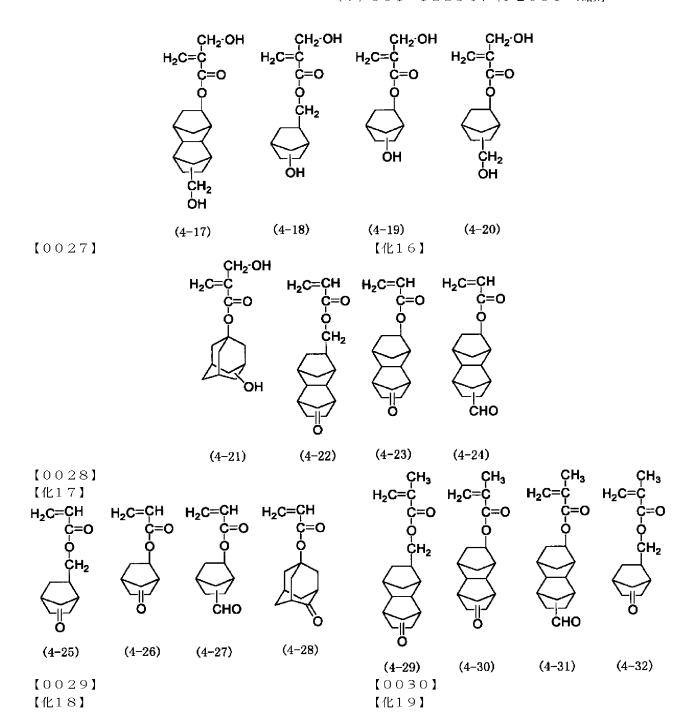
[0022]

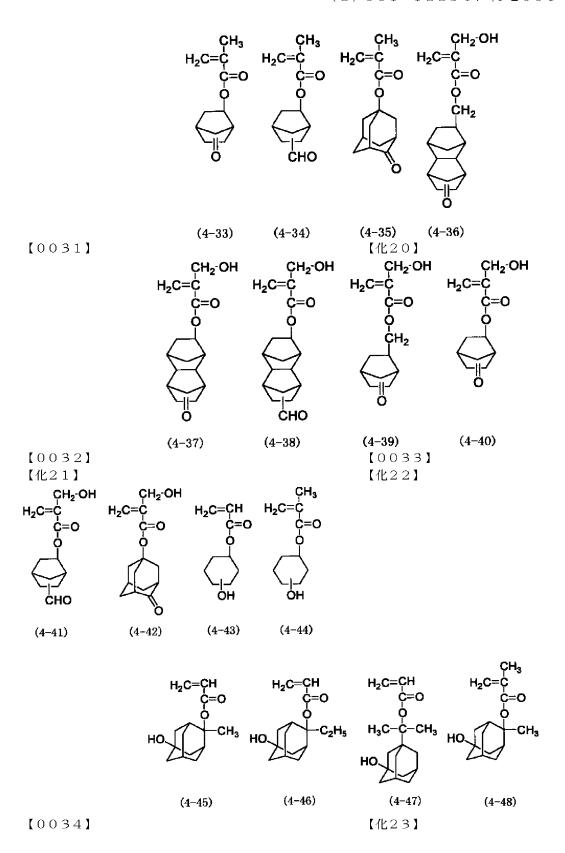
## 【化11】

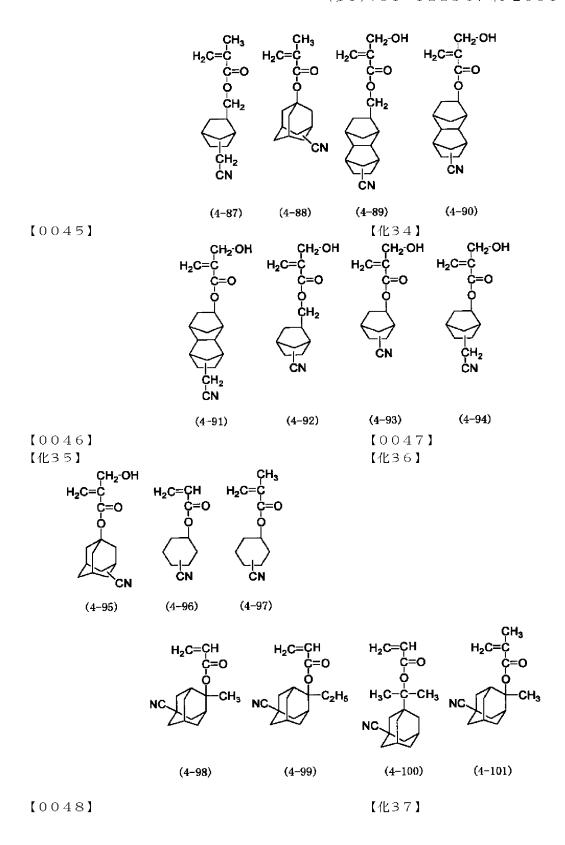
[0023]

【化12】









【0054】 【化43】

(4-126) (4-127)

【0055】これらの(メタ)アクリル酸誘導体(4)のうち、特に、式(4-1)、式(4-2)、式(4-4)、式(4-5)、式(4-7)、式(4-9)、式(4-12)、式(4-14)、式(4-28)または式(4-35)で表される化合物等が好ましい。樹脂(A)において、繰返し単位(4)は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

【0056】樹脂(A)において、繰返し単位(1)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、5~85モル%、好ましくは10~80モル%、さらに好ましくは15~70モル%である。この場合、繰返し単位(1)の含有率が5モル%未満では、得られるレジストの基板への接着性が低下する傾向があり、一方、85モル%を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向があ

【0057】次に、一般式(2)において、R<sup>6</sup>の炭素 数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基として は、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i -プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、 1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることが できる。また、R6 の炭素数1~4の直鎖状もしくは分 岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、 エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n ーブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプ ロポキシ基、セーブトキシ基等を挙げることができる。 また、R6 の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のと ドロキシアルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチ ル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピ ル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチ ル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル 基、4-ヒドロキシブチル基等を挙げることができる。 これらのR<sup>6</sup>のうち、特に、水素原子、メチル基等が好 ましい。

【0058】一般式(2)において、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> の 炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基並びに2つの R<sup>8</sup> が相互に結合して形成した炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格、テトラシクロドデカン骨格や、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン

等のシクロアルカン骨格を有する基;これらの基を、例 えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロ ピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メ チルプロピル基、 t - ブチル基等の炭素数1~10の直 鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるい は1個以上で置換した基等の脂環式骨格を有する基を挙 げることができる。これらの脂環式炭化水素基のうち、 特に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシク ロデカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から 選ばれる脂環式骨格を有する基や、これらの基を前記直 鎖状、分岐状または環状のアルキル基で置換した基等が 好ましく、特に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨 格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデカン 骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基や、これら の基をメチル基あるいはエチル基で置換した基等が好ま UN.

【0059】また、R®の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2ーメチルプロピル基、tーブチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基のうち、特に、メチル基、エチル基等が好ましい。

【0060】さらに、一般式(2)における式(iv)で表される基としては、何れか2つの $R^8$ が相互に結合して、炭素数 $4\sim20$ の2価の脂環式炭化水素基、好まし

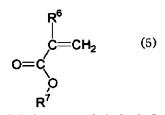
[0066]

くはアダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基並びにこれらの基をメチル基あるいはエチル基で置換した基の群から選ばれる基を形成し、残りのR®が炭素数1~4の鎖状アルキル基である基が望ましい。

【0061】繰返し単位(2)を与える単量体としては、例えば、下記一般式(5)で表される(メタ)アクリル酸誘導体(以下、「(メタ)アクリル酸誘導体(5)」という。」を挙げることができる。

[0062]

# 【化44】



[一般式(5)において、R<sup>6</sup> およびR<sup>7</sup> は一般式(2)のそれぞれR<sup>6</sup> およびR<sup>7</sup> と同義である。] 【0063】(メタ)アクリル酸誘導体(5)の具体例としては、下記式(5−1)から(5−30)で表される化合物等を挙げることができる。

[0064]

# 【化45】

【化47】

(5-29)

【0072】これらの(メタ)アクリル酸誘導体(5)のうち、式(5-1)、式(5-2)、式(5-3)、式(5-5)、式(5-6)または式(5-7)で表される化合物等が好ましい。樹脂(A)において、繰返し単位(2)は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

(5-30)

【0073】樹脂(A)において、繰返し単位(2)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、5~70モル%、好ましくは5~60モル%、さらに好ましくは5~50モル%である。この場合、繰返し単位(2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方70モル%を超えると、得られるレジストの基板への接着性が低下する傾向がある。

【0074】さらに、樹脂(A)は、他の重合性不飽和 単量体に由来する繰返し単位(以下、「他の繰返し単 位」という。)を1種以上有することもできる。好まし い他の繰返し単位としては、例えば、下記一般式(3) で表される繰返し単位(以下、「繰返し単位(3)」と いう。)を挙げることができる。

【0075】 【化53】

$$R^9$$
  $R^{10}$   $R^{12}$  (3)

〔一般式(3)において、 $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ および $R^{12}$ は相互に独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは非置換の炭素数  $1\sim6$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の直鎖状もしくは分岐状の炭素数  $1\sim6$ のアルコキシル基または炭素数  $2\sim2$ 0の酸解離性基を示し、mは0、1または2の整数である。〕

【0076】一般式(3)において、 $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$  および $R^{12}$ のハロゲン原子としては、例えば、ふっ素原子、塩素原子、臭素原子等を挙げることができる。また、 $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ および $R^{12}$ の置換もしくは非置換の炭素数  $1 \sim 6$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プロピル基、n-プロピル基、n-プロピル基、n-

【0077】また、 $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ および $R^{12}$ の置換もしくは非置換の炭素数 $1\sim6$ の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-ヘキシルオキシ基等を挙げることができる。

【0078】また、R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>11</sup>およびR<sup>12</sup>の炭素数2~20の酸解離性基(以下、「酸解離性基(i)」という。)としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基、nーペンチルオキシカルボニル基、nーペキシルオキシカ

ルボニル基、nーヘプチルオキシカルボニル基、n-オ クチルオキシカルボニル基、n-デシルオキシカルボニ ル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキ シルオキシカルボニル基、4-t-ブチルシクロヘキシ ルオキシカルボニル基、シクロヘプチルオキシカルボニ ル基、シクロオクチルオキシカルボニル基等の(シク ロ)アルコキシカルボニル基;フェノキシカルボニル 基、4-t-ブチルフェノキシカルボニル基、1-ナフ チルオキシカルボニル基等のアリーロキシカルボニル 基;ベンジルオキシカルボニル基、4-t-ブチルベン ジルオキシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル 基、4-t-ブチルフェネチルオキシカルボニル基等の アラルキルオキシカルボニル基; 1-メトキシエトキシ カルボニル基、1-エトキシエトキシカルボニル基、1 - n - プロポキシエトキシカルボニル基、1 - i - プロ ポキシエトキシカルボニル基、1-n-ブトキシエトキ シカルボニル基、1-(2'-メチルプロポキシ)エト キシカルボニル基、1-(1'-メチルプロポキシ)エ トキシカルボニル基、1-t-ブトキシエトキシカルボ ニル基、1-シクロヘキシルオキシエトキシカルボニル 基、1-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ)エ トキシカルボニル基等の1-(シクロ)アルキルオキシ エトキシカルボニル基:1-フェノキシエトキシカルボ ニル基、1-(4'-ブチルフェノキシ)エトキシカル ボニル基、1-(1'-ナフチルオキシ)エトキシカル ボニル基等の1-アリーロキシエトキシカルボニル基; 1-ベンジルオキシエトキシカルボニル基、1-(4) -t-ブチルベンジルオキシ)エトキシカルボニル基等 の1-アラルキルオキシエトキシカルボニル基; 【0079】メトキシカルボニルメトキシカルボニル

基、エトキシカルボニルメトキシカルボニル基、n-プ ロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、i-プロポ キシカルボニルメトキシカルボニル基、n-ブトキシカ ルボニルメトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシ カルボニルメトキシカルボニル基、1-メチルプロポキ シカルボニルメトキシカルボニル基、セーブトキシカル ボニルメトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカ ルボニルメトキシカルボニル基、4-t-ブチルシクロ ヘキシルオキシカルボニルメトキシカルボニル基等の (シクロ) アルコキシカルボニルメトキシカルボニル 基;メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニル メチル基、n-プロポキシカルボニルメチル基、i-プ ロポキシカルボニルメチル基、n-ブトキシカルボニル メチル基、2-メチルプロポキシカルボニルメチル基、 1-メチルプロポキシカルボニルメチル基、セーブトキ シカルボニルメチル基、シクロヘキシルオキシカルボニ ルメチル基、4-t-ブチルシクロヘキシルオキシカル ボニルメチル基等の(シクロ)アルコキシカルボニルメ チル基:フェノキシカルボニルメチル基、4-t-ブチ ルフェノキシカルボニルメチル基、1-ナフチルオキシ カルボニルメチル基等のアリーロキシカルボニルメチル基;ベンジルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブチルベンジルオキシカルボニルメチル基、フェネチルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブチルフェネチルオキシカルボニルメチル基等のアラルキルオキシカルボニルメチル基;

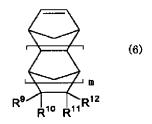
【0080】2-メトキシカルボニルエチル基、2-エ トキシカルボニルエチル基、2-n-プロポキシカルボ ニルエチル基、2-i-プロポキシカルボニルエチル 基、2-n-ブトキシカルボニルエチル基、2-(2) -メチルプロポキシ)カルボニルエチル基、2-(1' -メチルプロポキシ)カルボニルエチル基、2-t-ブ トキシカルボニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシ カルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルシクロへ キシルオキシカルボニル)エチル基等の2-(シクロ) アルコキシカルボニルエチル基;2-フェノキシカルボ ニルエチル基、2-(4'-t-ブチルフェノキシカル ボニル) エチル基、2-(1'-ナフチルオキシカルボ ニル) エチル基等の2-アリーロキシカルボニルエチル 基:2-ベンジルオキシカルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルベンジルオキシカルボニル) エチル 基、2-フェネチルオキシカルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルフェネチルオキシカルボニル) エチ ル基等の2-アラルキルオキシカルボニルエチル基や、 テトラヒドロフラニルオキシカルボニル基、テトラヒド ロピラニルオキシカルボニル基等を挙げることができ

【0081】これらの酸解離性基(i)のうち、基-COOR'〔但し、R'は炭素数 $1\sim19$ の( $\nu$ 0)アルキル基を示す。〕または基-COOCH $_2$ COOR'〔但し、R'は炭素数 $1\sim17$ の( $\nu$ 0)アルキル基を示す。〕に相当するものが好ましく、特に好ましくは、 $\nu$ 1、七 $\nu$ 2、大きシカルボニル基、 $\nu$ 3、七 $\nu$ 3、七 $\nu$ 4、七 $\nu$ 5、十 $\nu$ 5、一般式(3)におけるmとしては、 $\nu$ 3、0または $\nu$ 5が好ましい。

【0082】繰返し単位(3)を与える単量体としては、例えば、下記一般式(6)で表されるノルボルネン誘導体(以下、「ノルボルネン誘導体(6)」という。)を挙げることができる。

# [0083]

【化54】



〔一般式(6)において、 $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ およびmは一般式(3)のそれぞれ $R^9$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 

およびmと同義である。〕

【0084】ノルボルネン誘導体(6)のうち、mが0 で、かつ酸解離性基(i)を有する化合物の具体例とし ては、5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーエトキシカルボニルビシクロ[ 2.2.1]ヘプトー2ーエン、5ーnープロポキシカ ルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5 -i-プロポキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へ プトー2-エン、5-n-ブトキシカルボニルビシクロ [ 2. 2. 1 ]ヘプトー2ーエン、5ー(2'ーメチル プロポキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5-(1'-メチルプロポキシ)カルボニ ルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2 ーエン、5ーシクロヘキシルオキシカルボニルビシクロ チルシクロヘキシルオキシ)カルボニルビシクロ[2. 2.1]ヘプトー2ーエン、5ーフェノキシカルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-(1) -エトキシエトキシ)カルボニルビシクロ[2.2.1 ]ヘプト-2-エン、5-(1'-シクロヘキシルオキ シエトキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5-t-ブトキシカルボニルメトキシカル ボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルビシクロ[2. 2.1]ヘプトー2ーエン、5ーテトラヒドロピラニル オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ー エン、

【0085】5-メチル-5-メトキシカルボニルビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5 ーエトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2-エン、5-メチル-5-n-プロポキシカルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル -5 - i - プロポキシカルボニルビシクロ[2.2.1]]ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーnーブトキシカ ルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5 ーメチルー5ー(2'ーメチルプロポキシ)カルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル -5-(1'-メチルプロポキシ)カルボニルビシクロ  $[2.2.1] \land 7 \land -2 - x \lor 5 - x + y - 5 - t$ ーブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2-エン、5-メチル-5-シクロヘキシルオキシカル ボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチルー5ー(4'ーtーブチルシクロヘキシルオキ シ) カルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エ ン、5-メチル-5-フェノキシカルボニルビシクロ[ 2. 2. 1 ]ヘプト-2-エン、5-メチル-5-(1'-エトキシエトキシ)カルボニルビシクロ[2. 2. 1]ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ー(1'ー シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニルビシクロ[

2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーtーブトキシカルボニルメトキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒドロフラニルオキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒドロピラニルオキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、

【0086】5,6ージ(メトキシカルボニル)ビシク ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(エト キシカルボニル) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ー エン、5,6-ジ(n-プロポキシカルボニル)ビシク ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(i-プロポキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5,6-ジ(n-ブトキシカルボニル)ビ シクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ (2'ーメチルプロポキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ]ヘプトー2ーエン、5,6ージ(1'ーメチル プロポキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5,6-ジ(t-ブトキシカルボニル)ビ シクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエン、5,6ージ (シクロヘキシルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ]ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5,6ージ(フェノキシカ ルボニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエン、 5,6-ジ(1'-エトキシエトキシカルボニル)ビシ クロ[2.2.1]ヘプトー2ーエン、5,6ージ (1) ーシクロヘキシルオキシエトキシカルボニル)ビ シクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエン、5,6ージ (t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル) ビシク ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(テト ラヒドロフラニルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ]ヘプトー2ーエン、5,6ージ(テトラヒドロ ピラニルオキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]へ プトー2ーエン等を挙げることができる。

【0087】また、ノルボルネン誘導体(6)のうち、mが1で、かつ酸解離性基(i)を有する化合物の具体例としては、8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-エトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-n-プロポキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-i-プロポキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-i-プロポキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-n-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-(2'-メチルプロポキシ)カルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-(1'-メチルプロポキシ)カルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-(1'-メチルプロポキシ)カルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8-0

-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3-エン、8-シクロヘキシ ルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-エン、8-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニルテトラシクロ [  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]  $\ddot{r}\ddot{r}\dot{n}-3-x\dot{r}\dot{r}\dot{r}\dot{r}$ フェノキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 <sup>2,5</sup> . 1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3ーエン、8ー(1'ーエトキ シエトキシ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 2,5. 17,10 ]ドデカー3-エン、8-(1'-シクロ ヘキシルオキシエトキシ)カルボニルテトラシクロ[ 4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカー3-エン、8t ーブトキシカルボニルメトキシカルボニルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 8-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 8-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルテトラシク ロ[ 4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3-エン、 【0088】8-メチル-8-メトキシカルボニルテト ラシクロ[ 4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3-エン、8-メチル-8-エトキシカルボニルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカ-3-エン、 8-メチル-8-n-プロポキシカルボニルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-i-プロポキシカルボニルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-n-ブトキシカルボニルテトラシクロ [ 4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカー3-エン、8 ーメチルー8ー(2'ーメチルプロポキシ)カルボニル テトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]ドデカー 3-エン、8-メチル-8-(1'-メチルプロポキ シ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1 7,10 ]ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ーtーブトキ シカルボニルテトラシクロ[4.4.0.12,5.1] 7,10 ]ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ーシクロヘキ シルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1] <sup>2,5</sup> . 1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3-エン、8-メチル-8-(4) - t - ブチルシクロヘキシルオキシ)カルボニル テトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]ドデカー 3-エン、8-メチル-8-フェノキシカルボニルテト ラシクロ[  $4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}$  ]ドデカー3ー エン、8-メチル-8-(1'-エトキシエトキシ)カ ルボニルテトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ] ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ー(1'ーシクロへ キシルオキシエトキシ)カルボニルテトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8ーメチ ルー8-t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニルテ トラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]ドデカー3 ーエン、8ーメチルー8ーテトラヒドロフラニルオキシ カルボニルテトラシクロ[4.4.0.12,5.17,10] ]ドデカー3-エン、8-メチルー8-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{7,10}$ ]ドデカー3-エン、

【0089】8,9-ジ(メトキシカルボニル)テトラ シクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカー3ーエ ン、8,9-ジ(エトキシカルボニル)テトラシクロ[ 4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8, 9-ジ(n-プロポキシカルボニル)テトラシクロ[ 4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカー3ーエン、8、 9 - ジ ( i - プロポキシカルボニル ) テトラシクロ[ 4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ]ドデカ-3-エン、8, 9-ジ(n-ブトキシカルボニル)テトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8,9ー ジ(2'ーメチルプロポキシカルボニル)テトラシクロ [  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]  $\ddot{r}\ddot{r}\dot{r}$   $-3-x\dot{r}$ . 8,9-ジ(1'-メチルプロポキシカルボニル)テト ラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]ドデカー3ー エン、8,9-ジ(t-ブトキシカルボニル)テトラシ クロ $\{4, 4, 0, 1^{2,5}, 1^{7,10}\}$ ドデカー3ーエ ン、8、9 - ジ(シクロヘキシルオキシカルボニル)テ トラシクロ[  $4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}$  ]ドデカー3 ーエン、8,9ージ(4'-t-ブチルシクロヘキシル オキシカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8,9ージ(フェ ノキシカルボニル)テトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8,9ージ(1' -エトキシエトキシカルボニル)テトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8, 9ー ジ(1'-シクロヘキシルオキシエトキシカルボニル) テトラシクロ $[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]$ ドデカー 3-エン、8,9-ジ(t-ブトキシカルボニルメトキ シカルボニル) テトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1$ 7,10 ]ドデカー3ーエン、8,9ージ(テトラヒドロフ ラニルオキシカルボニル)テトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5} \cdot 1^{7,10}$  ]  $\ddot{r}$   $\ddot{r}$   $\dot{r}$   $\dot{r}$   $\dot{r}$   $\dot{r}$   $\dot{r}$   $\dot{r}$ ラヒドロピラニルオキシカルボニル)テトラシクロ[ 4.4.0.12,5.17,10]ドデカー3-エン等が挙 げることができる。

【0090】また、ノルボルネン誘導体(6)のうち、酸解離性基(i)をもたない化合物の具体例としては、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、テトラシクロ[4.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{7,10}$ ]ドデカー3ーエン、8ーエチルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{7,10}$ ]ドデカー3ーエン、8ーエチルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{7,10}$ ]ドデカー3ーエン、8ーエチルテトラシクロ[4.4.0.1

 $^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-ヒドロキシメチルテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-フルオロテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-フルオロメチルテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-ジフルオロメチルテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-トリフルオロメチルテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、8-ペンタフルオロエチルテトラシクロ[ 4 . 4 . 0 .  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-xv、 $1^{7,10}$  ]

【0091】8,8-ジフルオロテトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3-エン、8,9-ジフルオロテトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ] ]ドデカー3ーエン、8,8ービス(トリフルオロメチ ル) テトラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデ カー3ーエン、8、9ービス(トリフルオロメチル)テ トラシクロ[4.4.0.12,5.17,10]ドデカー3 ーエン、8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシ クロ[  $4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}$  ]ドデカ-3-エ ン、8, 8, 9-トリフルオロテトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカ-3-エン、8, 8, 9-トリス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4. 0.  $1^{2,5}$ .  $1^{7,10}$  ] FFD-3-x, 8, 8, 9, 9-テトラフルオロテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5} \cdot 1^{7,10}$ ]  $\ddot{r}\ddot{r}\dot{n}-3-x\dot{r}\dot{r}\dot{r}\dot{r}\dot{r}\dot{r}$ テトラキス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 【0092】8,8-ジフルオロー9,9-ビス(トリ フルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>. 9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4. 4. 0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8, 8, 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメチルテトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、 8,8,9-トリフルオロ-9-トリフルオロメトキシ テトラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー 3-エン、8,8,9-トリフルオロ-9-ペンタフル オロプロポキシテトラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1$ 7,10 ]ドデカー3ーエン、8ーフルオロー8ーペンタフ ルオロエチルー9,9ービス(トリフルオロメチル)テ トラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカ-3ーエン、8,9ージフルオロー8ーヘプタフルオロイソ プロピルー9ートリフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. 1<sup>2,5</sup> . 1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3-エン、8-クロ D-8, 9, 9-トリフルオロテトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8, 9ージク ロロー8,9ービス(トリフルオロメチル)テトラシク ロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカ-3-エン、 8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボキシエチ

ル)テトラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン、8-メチルー8-(2',2',2'-トリフルオロカルボキシエチル)テトラシクロ[  $4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$  ]ドデカー3ーエン等を挙げることができる。

【0093】これらのノルボルネン誘導体(6)のうち、特に、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{7,10}$ ]ドデカー3-エン等が好ましい。

【0094】さらに、繰返し単位(3)以外の他の繰返 し単位を与える単量体としては、例えば、ジシクロペン タジエン、トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>] デカー8 ーエン、トリシクロ[5.2.1.0 $^{2,6}$ ] デカー3ー エン、トリシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}$ ] ウンデカー3 ーエン、トリシクロ[6.2.1.0 $^{1,8}$ ] ウンデカー 9-xン、トリシクロ[6.2.1. $0^{1,8}$ ] ウンデカ -4 - エン、テトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1]  $^{7,10}$ .  $0^{1,6}$  ] ドデカー3ーエン、8ーメチルテトラシ クロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}.0^{1,6}$  ] ドデカー 3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4.0.  $1^{2,5}$  .  $1^{7,12}$  ]ドデカー3ーエン、8ーエチリデンテ トラシクロ[  $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}.0^{1,6}$  ] ド デカー3ーエン、ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,6</sup>.  $0^{2,7} \cdot 0^{9,13}$  ]  $^{2}$ [ 7.4.0.1 $^{2,5}$ .1 $^{9,12}$ .0 $^{8,13}$ ]ペンタデカー 3ーエンのほか、

 $[0095]\alpha - (y)$ トキシカルボニルー $\gamma$  – ブチロラクトン、 $\alpha$  – (メタ) アクリロイルオキシーβ-エトキシカルボニル-γ-ブ チロラクトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシ- $\beta$  n-プロポキシカルボニル $-\gamma-$ ブチロラクトン、 $\alpha-$ ボニル $-\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メタ) アクリロイ  $\nu$ オキシー $\beta$ -n-ブトキシカルボニル- $\gamma$ -ブチロラ クトン、 $\alpha - ($ メタ) アクリロイルオキシ $-\beta - ($ 2-メチルプロポキシ) カルボニルー $\gamma$ ーブチロラクトン、 ロポキシ) カルボニルー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メ タ) アクリロイルオキシーβ-t-ブトキシカルボニル  $-\gamma$  – ブチロラクトン、 $\alpha$  – (メタ) アクリロイルオキ シ $-\beta$ -シクロヘキシルオキシカルボニル $-\gamma$ -ブチロ ラクトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシー $\beta$  - (4) -t-ブチルシクロヘキシルオキシ)カルボニル-*γ*-ブチロラクトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシ-  $\beta$ -フェノキシカルボニル- $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-エトキシエト キシ) カルボニルー $\gamma$  - ブチロラクトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-シクロヘキシルオキシ エトキシ) カルボニルー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メ  $[0096]\alpha-\lambda$ トキシカルボニル $-\beta-(\lambda\beta)$ ア クリロイルオキシー $\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$ ーエトキシ カルボニル $-\beta$  - (メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$  - ブ チロラクトン、 $\alpha-n-$ プロポキシカルボニル $-\beta-$ (メタ) アクリロイルオキシーγ-ブチロラクトン、α-i-プロポキシカルボニル $-\beta-($ メタ) アクリロイ ルオキシー $\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$  - n - ブトキシカル ボニル $-\beta$ -(メタ) アクリロイルオキシ- $\gamma$ -ブチロ (メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -t-ブトキシカルボニル-β-(メタ)アクリロイル オキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -シクロヘキシルオキ シカルボニルー $\beta$  - (メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$  -ブチロラクトン、 $\alpha - (4 - t - )$ チルシクロヘキシル オキシ)カルボニルーβー(メタ)アクリロイルオキシ  $-\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$ ーフェノキシカルボニルー $\beta$ – (メタ)アクリロイルオキシーィーブチロラクトン、  $\alpha - (1 - x + y + x + y)$   $\beta - (x + y + y)$ β) アクリロイルオキシーγ-ブチロラクトン、α-(1-シクロヘキシルオキシエトキシ)カルボニルーβ **-(メタ)アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトン、**  $\alpha$  – t – ブトキシカルボニルメトキシカルボニル –  $\beta$  – (メ P) アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、α ーテトラヒドロフラニルオキシカルボニルーβー(メ タ) アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -テ トラヒドロピラニルオキシカルボニル-β-(メタ)ア クリロイルオキシーアーブチロラクトン等の酸解離性基 を有する(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物;  $[0097]\alpha - (yy)$  アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブ チロラクトン、 $\alpha - (メタ)$  アクリロイルオキシー $\beta -$ フルオロー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メタ)アクリロ イルオキシ $-\beta$ ーヒドロキシ $-\gamma$ -ブチロラクトン、α -(xy) アクリロイルオキシー $\beta$  -x チルー $\gamma$  - ブチ ロラクトン、 $\alpha-(メタ)$  アクリロイルオキシー $\beta-$ エ チルー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メタ)アクリロイル オキシー $\beta$ ,  $\beta$  – ジメチルー $\gamma$  – ブチロラクトン、 $\alpha$  – ロラクトン、 $\beta$  - (メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$  - ブ チロラクトン、 $\alpha$  - フルオロ -  $\beta$  - (メタ) アクリロイ ルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -ヒドロキシー $\beta$ --x+ $\mu$ - $\mu$  ロラクトン、 $\alpha$ ーエチルー $\beta$ ー(メタ)アクリロイルオキシー $\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ージメチルー $\beta$ ー(メタ)アクリロイルオキシー $\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$ ーメトキシー $\beta$ ー(メタ)アクリロイルオキシー $\gamma$ ーブチロラクトン、 $\alpha$ ー(メタ)アクリロイルオキシー $\beta$ ーメバロノラクトン等の酸解離性基をもたない(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物;

【0098】(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アク リル酸エチル、(メタ)アクリル酸n-プロピル、(メ タ)アクリル酸i-プロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸 tーブチル等の他の(メ タ)アクリル酸エステル類;α-ヒドロキシメチルアク リル酸メチル、αーヒドロキシメチルアクリル酸エチル 等 $\alpha$  -ヒドロキシメチルアクリル酸エステル類; 酢酸 ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエ ステル類; (メタ) アクリロニトリル、α-クロロアク リロニトリル等の不飽和ニトリル化合物; (メタ)アク リルアミド、N, N-ジメチル(メタ)アクリルアミド 等の不飽和アミド化合物; N-ビニル $-\varepsilon-$ カプロラク タム、Nービニルピロリドン、2 ービニルピリジン、3 ービニルピリジン、4ービニルピリジン、Nービニルイ ミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物; (メタ)アク リル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸等の 不飽和カルボン酸(無水物)類; (メタ)アクリル酸2 ーカルボキシエチル、(メタ)アクリル酸2ーカルボキ シプロピル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシプロピ ル等の不飽和カルボン酸のカルボキシル基含有エステル 類等の単官能性単量体や、メチレングリコールジ(メ タ) アクリレート、エチレングリコールジ(メタ) アク リレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレー ト、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレー ト、2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート等の多官能性単量体等を挙げるこ とができる。

【0099】これらの繰返し単位(3)以外の他の繰返 し単位を与える単量体のうち、無水マレイン酸、(メ タ)アクリロイルオキシラクトン化合物等が好ましく、 特に、無水マレイン酸、 $\alpha-(メタ)$ アクリロイルオキ シー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ -(メタ) アクリロイルオ キシ $-\beta$ -メチル $-\gamma$ -ブチロラクトン、 $\beta$ -(メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ - (メ タ) アクリロイルオキシー δ - メバロノラクトン等が好 ましい。なお、無水マレイン酸は、ノルボルネン誘導体 (6)との共重合性が良好であり、樹脂(A)がノルボ ルネン誘導体(6)に由来する繰返し単位(3)を有す る場合、無水マレイン酸をノルボルネン誘導体(6)と 共重合させることにより、得られる樹脂(A)の分子量 を所望の値にまで大きくすることができる。前記繰返し 単位(3)以外の他の繰返し単位を与える単量体は、単 独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0100】樹脂(A)において、繰返し単位(3)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、60モル%以下、好ましくは5~50モル%、さらに好ましくは10~40モル%であり、また繰返し単位(3)以外の他の繰返し単位の含有率は、通常、60モル%以下、好ましくは50モル%以下、さらに好ましくは40モル%以下である。この場合、繰返し単位(3)およびそれ以外の他の繰返し単位の各含有率が60モル%を超えると、レジストとしての解像度が低下する傾向がある。

【0101】樹脂(A)は、例えば、(メタ)アクリル 酸誘導体(4)および(メタ)アクリル酸誘導体(5) を、場合により他の繰返し単位を与える単量体ととも に、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド 類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル 重合開始剤を使用し、適当な溶媒中で共重合することに より製造することができる。共重合に使用される溶媒と しては、例えば、nーペンタン、nーヘキサン、nーヘ プタン、nーオクタン、nーノナン、nーデカン等のア ルカン類;シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオ クタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン 類;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 クメン等の芳香族炭化水素類;クロロブタン類、ブロモ ヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロ ミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;酢酸 エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン 酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類;テトラヒドロ フラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等の エーエル類等を挙げることができる。これらの溶媒は、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができ

【0102】樹脂(A)のゲルパーミエーションクロマ トグラフィー(GPC)によるポリスチレン換算重量平 均分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、3,0 00~300,000、好ましくは4,000~20 0,000、さらに好ましくは5,000~100,0 00である。この場合、樹脂(A)のMwが3,000 未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があ り、一方300,000を超えると、レジストとしての 現像性が低下する傾向がある。なお、本発明における樹 脂(A)は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないほど好 ましく、それにより、感放射線性樹脂組成物のレジスト としての感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状 等がさらに改善される。樹脂(A)の精製法としては、 例えば、水洗、液々抽出等の化学的精製法や、これらの 化学的精製法と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法と の組み合わせ等を挙げることができる。本発明におい て、樹脂(A)は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。

## 【0103】酸発生剤(B)

本発明における(B)成分は、露光により酸を発生する

感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」という。)からなる。酸発生剤(B)は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを形成する作用を有するものである。このような酸発生剤(B)としては、オニウム塩、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物等を挙げることができる。これらの酸発生剤(B)の例としては、下記のものを挙げることができる。

【0104】オニウム塩:オニウム塩としては、例え ば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩 (テトラヒドロチ オフェニウム塩を含む。)、ホスホニウム塩、ジアゾニ ウム塩、ピリジニウム塩等を挙げることができる。好ま しいオニウム塩の具体例としては、ジフェニルヨードニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムピレンスルホネート、ジフェニルヨ ードニウム nードデシルベンゼンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジ フェニルヨードニウムナフタレンスルホネート、ジフェ ニルヨードニウム 10-カンファースルホネート、ビ ス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネー ト、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムピレ ンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨー ドニウム n-ドデシルベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオ ロアンチモネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨ ードニウムナフタレンスルホネート、ビス(4-t-ブ チルフェニル) ヨードニウム 10-カンファースルホ ネート、

【0105】トリフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフル オローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウムピレンスルホネート、トリフェニルスルホニウム n-ドデシルベンゼンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニル スルホニウムナフタレンスルホネート、トリフェニルス ルホニウム 10-カンファースルホネート、4-ヒド ロキシフェニル・フェニル・メチルスルホニウムpート ルエンスルホネート、4-ヒドロキシフェニル・ベンジ ル・メチルスルホニウムトルエンスルホネート、シクロ ヘキシル・メチル・2-オキソシクロヘキシルスルホニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシ ル・2-オキソシクロヘキシル・スルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、ジメチル・2-オキソシクロ ヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーシアノー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーニトロー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーメチルー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーニトロー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーニトロー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、

【0106】4ーヒドロキシー1ーナフチルテトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 -メトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-エトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4-n-プロポキシー1-ナフチルテ トラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、4-i-プロポキシー1-ナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブトキシ -1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-メトキシメトキシ-1-ナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4-エトキシメトキシ-1-ナフチルテ トラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、4-(1'-メトキシエトキシ)-1-ナフチル テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、4-(2'-メトキシエトキシ)-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-メトキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-n-プロポキシカルボニルオキシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4-i-プロポキシカルボニルオキシ -1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-n-ブトキシカルボニルオ キシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、4-t-ブトキシカルボニ ルオキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-(2'-テトラヒ ドロフラニルオキシ) -1-ナフチルテトラヒドロチオ フェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-(2) ーテトラヒドロピラニルオキシ) -1-ナフチル 【0107】ハロゲン含有化合物:ハロゲン含有化合物としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げることができる。好ましいハロゲン含有化合物の具体例としては、フェニルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、1-ナフチルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン等の(トリクロロメチル)-s-トリアジン誘導体や、1, 1-ビス(4'-クロロフェニル)-2, 2, 2-トリクロロエタン等を挙げることができる。

ジアゾケトン化合物:ジアゾケトン化合物としては、例えば、1, 3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げることができる。好ましいジアゾケトンの具体例としては、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルクロリド、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、2, 3, 4, 4 -テトラヒドロキシベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフェニル)エタンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙げることができる。

スルホン化合物: スルホン化合物としては、例えば、 $\beta$  ーケトスルホン、 $\beta$  ースルホニルスルホンや、これらの化合物の $\alpha$  ージアゾ化合物等を挙げることができる。好ましいスルホン化合物の具体例としては、4 ートリルフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン等を挙げることができる。

スルホン酸化合物:スルホン酸化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。好ましいスルホン酸化合物の具体例としては、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリス(トリフルオロメタンスルホネート)、ニトロベンジルー9,10-ジエトキシアントラセンー2-スルホネート、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、Nーヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンスルホネート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフル

オロメタンスルホネート等を挙げることができる。

【0108】これらの酸発生剤(B)のうち、特に、ジ フェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネー **ト、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムトリ** フルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフ ェニル) ヨードニウムノナフルオロー n ーブタンスルホ ネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタン スルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ -n-ブタンスルホネート、シクロヘキシル・メチル・ 2-オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシク ロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジメチル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシー1 ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 - n - ブトキシー 1 - ナフチルテトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(1'-ナ フチルアセトメチル) テトラヒドロチオフェニウムトリ フルオロメタンスルホネート、トリフルオロメタンスル ホニルビシクロ[2.2.1]  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 3-ジカルボジイミド、N-ヒドロキシスクシイミドト リフルオロメタンスルホネート、1,8-ナフタレンジ カルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート等が 好ましい。

【0109】本発明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸発生剤(B)の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に対して、通常、0.1~10重量部、好ましくは0.5~7重量部である。この場合、酸発生剤(B)の使用量が0.1重量部未満では、レジストとしての感度および現像性が低下する傾向があり、一方10重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、レジストとして矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。

【0110】<u>各種添加剤</u> た発明の成故射線燃料形

本発明の感放射線性樹脂組成物は、露光により酸発生剤(B)から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域での好ましくない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することができる。このような酸拡散制御剤を使用することにより、組成物の貯蔵安定性がより向上し、またレジストとして解像度がさらに向上するとともに、露光から現像までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性がさらに改善される。酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式(7)

【0111】 【化55】

$$R^{14}$$
 $R^{13}$ 
 $N$ 
 $R^{15}$ 
 $(7)$ 

【0112】〔一般式(7)において、R<sup>13</sup>、R<sup>14</sup>およ びR15は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の アルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置 換もしくは非置換のアラルキル基を示す。〕で表される 化合物(以下、「含窒素化合物(イ)」という。)、同 一分子内に窒素原子を2個有するジアミノ化合物(以 下、「含窒素化合物(ロ)」という。)、窒素原子を3 個以上有するジアミノ重合体(以下、「含窒素化合物 (ハ)」という。)、アミド基含有化合物、ウレア化合 物、含窒素複素環化合物等を挙げることができる。含窒 素化合物(イ)としては、例えば、 n-ヘキシルアミ ン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノ ニルアミン、nーデシルアミン、シクロヘキシルアミン 等のモノ(シクロ)アルキルアミン類;ジーn-ブチル アミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーヘキシルア ミン、ジー n ーヘプチルアミン、ジー n ーオクチルアミ ン、ジーnーノニルアミン、ジーnーデシルアミン、シ クロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等 のジ(シクロ)アルキルアミン類;トリエチルアミン、 トリーnープロピルアミン、トリーnーブチルアミン、 トリーnーペンチルアミン、トリーnーヘキシルアミ ン、トリーnーヘプチルアミン、トリーnーオクチルア ミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミ ン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチルジシクロヘ キシルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シ クロ) アルキルアミン類; アニリン、N-メチルアニリ ン、N, Nージメチルアニリン、2ーメチルアニリン、 3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロ アニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、1 ーナフチルアミン等の芳香族アミン類等を挙げることが できる。

【0113】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エチレンジアミン、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノジフェニルアミノジフェニルアミン、2,2-ビス(4'-アミノフェニル)ー2ー(4'-アミノフェニル)プロパン、2ー(3'-ヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4'-アミノフェニル)プロパン、2ー(4'-アミノフェニル)プロパン、1,4-ビス〔1'-(4''-アミノフェニル)ー1'-メチルエチル〕ベンゼン、1,3-ビス〔1'-(4''-アミノフェニル)ー1'-メチ

ルエチル〕ベンゼン等を挙げることができる。含窒素化 合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポ リアリルアミン、ジメチルアミノエチルアクリルアミド の重合体等を挙げることができる。前記アミド基含有化 合物としては、例えば、ホルムアミド、N-メチルホル ムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、アセトアミ ド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリド ン、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。前 記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレ ア、1,1-ジメチルウレア、1,3-ジメチルウレ ア、1,1,3,3-テトラメチルウレア、1,3-ジ フェニルウレア、トリーn-ブチルチオウレア等を挙げ ることができる。前記含窒素複素環化合物としては、例 えば、イミダゾール、ベンズイミダゾール、4-メチル イミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール 等のイミダゾール類;ピリジン、2-メチルピリジン、 4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチル ピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジ ン、2-メチル-4-フェニルピリジン、ニコチン、ニ コチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキ シキノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のピリ ジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キ ノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリ ン、4-メチルモルホリン、ピペラジン、1, 4-ジメ チルピペラジン、1-(2'-ヒドロキシエチル)ピペ ラジン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタ ン等を挙げることができる。

【0114】これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素化合物(イ)、含窒素複素環化合物等が好ましい。また、含窒素化合物(イ)の中では、トリ(シクロ)アルキルアミン類が特に好ましく、含窒素複素環化合物の中では、ピリジン類、ピペラジン類が特に好ましい。前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸拡散制御剤の配合量は、樹脂(A)100重量部に対して、通常、15重量部以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは5重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が15重量部を超えると、レジストとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散制御剤の配合量が0.001重量部未満では、プロセス条件によっては、レジストとしてのパターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

【0115】また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す、酸解離性有機基を有する脂環族添加剤を配合することができる。このような脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボン酸t-ブチル、1,3-アダマンタンジカルボン酸ジーt-ブ

チル、1-アダマンタン酢酸t-ブチル、3-アダマン タン酢酸セーブチル、1,3-アダマンタンジ酢酸ジー t-ブチル等のアダマンタン誘導体類;デオキシコール 酸セーブチル、デオキシコール酸セーブトキシカルボニ ルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオ キシコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキ シコール酸3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール 酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラ クトンエステル等のデオキシコール酸エステル類;リト コール酸セーブチル、リトコール酸セーブトキシカルボ ニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコ ール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸 3-オキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロ ピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等の リトコール酸エステル類等を挙げることができる。これ らの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができる。脂環族添加剤の配合量は、樹脂 (A) 100重量部に対して、通常、50重量部以下、 好ましくは30重量部以下である。この場合、脂環族添 加剤の配合量が50重量部を超えると、レジストとして の耐熱性が低下する傾向がある。

【0116】また、他の添加剤としては、塗布性、現像 性等を改良する作用を示す界面活性剤を挙げることがで きる。前記界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエ チレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ ルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポ リオキシエチレンn-オクチルフェニルエーテル、ポリ オキシエチレンn-ノニルフェニルエーテル、ポリエチ レングリコールジラウレート、ポリエチレングリコール ジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下 商品名で、KP341(信越化学工業(株)製)、ポリ フローNo. 75, 同No. 95(共栄社化学(株) 製)、エフトップEF301,同EF303,同EF3 52(トーケムプロダクツ(株)製)、メガファックス F171, 同F173 (大日本インキ化学工業(株) 製)、フロラードFC430,同FC431(住友スリ ーエム(株)製)、アサヒガードAG710,サーフロ ンS-382, 同SC-101, 同SC-102, 同S C-103, 同SC-104, 同SC-105, 同SC -106(旭硝子(株)製)等を挙げることができる。 これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。界面活性剤の配合量は、樹脂 (A)と酸発生剤(B)との合計100重量部に対し て、通常、2重量部以下である。また、前記以外の添加 剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定 化剤、消泡剤等を挙げることができる。

# 【0117】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、通常、その使用に際して、全固形分濃度が、例えば5~50重量%、好ましくは10~25重量%となるように、溶剤に溶解したの

ち、例えば孔径O.2μm程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-ブタノン、2ーペンタノン、3ーメチルー2ーブタノ ン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3 ーメチルー2ーペンタノン、3,3ージメチルー2ーブ タノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状も しくは分岐状のケトン類;シクロペンタノン、2-メチ ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ クロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類;プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール リコールモノー i ープロピルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノーi-ブチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノーsec-ブチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノーt-ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類;2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸 n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸 i -プロピル、2-ヒドロキシプロピ オン酸 n - ブチル、2 - ヒドロキシプロピオン酸 i - ブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 ーヒドロキシプロピオン酸t-ブチル等の2-ヒドロキ シプロピオン酸アルキル類のほか、

【0118】nープロピルアルコール、iープロピルア ルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコー ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチ レングリコールモノーn-ブチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピ ルエーテル、ジエチレングリコールジー n - ブチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノーnープロピルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノーnープロピルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸 エチル、酢酸nープロピル、酢酸nーブチル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキシプロピオン 酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン 酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メチルピロリドン、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテ ル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ レングリコールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプ リル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジル アルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸 ジエチル、マレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、 炭酸エチレン、炭酸プロピレン等を挙げることができ る。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができるが、就中、直鎖状もしくは分岐状 のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロ ピオン酸アルキル類が好ましい。

# 【0119】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用 によって、樹脂(A)中の酸解離性基が解離して、例え ばカルボキシル基等の酸性官能基に変換される反応を生 じ、その結果レジストの露光部のアルカリ現像液に対す る溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によっ て溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られ る。本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパター ンを形成する際には、感放射線性樹脂組成物を、回転塗 布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によっ て、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆さ れたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジス ト被膜を形成し、場合により予めプレベーク(以下、 「PB」という。)を行ったのち、所定のレジストパタ ーンを形成するように該レジスト被膜に露光する。その 際に使用される放射線としては、酸発生剤(B)の種類 に応じて、遠紫外線、X線、電子線等を適宜選定して使 用することができるが、特に、ArFエキシマレーザー (波長193nm) あるいはKrFエキシマレーザー (波長248nm)が好ましい。本発明においては、露 光後に加熱処理(以下、「PEB」という。)を行うこ とが好ましい。このPEBにより、樹脂(A)中の酸解 離性基の解離反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件 は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わる が、通常、30~200℃、好ましくは50~170℃ である。本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜 在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12 452号公報等に開示されているように、使用される基 板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成してお くこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純 物等の影響を防止するため、例えば特開平5-1885 98号公報等に開示されているように、レジスト被膜上 に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を 併用することもできる。

【0120】次いで、露光されたレジスト被膜を現像す ることにより、所定のレジストパターンを形成する。現 像に使用される現像液としては、例えば、水酸化ナトリ ウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリ ウム、メタけい酸ナトリウム、アンモニア水、エチルア ミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーnー プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルア ミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、 テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピ ペリジン、コリン、1,8-ジアザビシクロー[5. 4.0]-7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロー [4.3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少 なくとも1種を溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。 前記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下 である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10重量 %を超えると、未露光部も現像液に溶解し、好ましくな い。また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液には、 例えば有機溶剤を添加することもできる。前記有機溶剤 の具体例としては、アセトン、2-ブタノン、4-メチ ルー2ーペンタノン、シクロペンタノン、2ーメチルシ クロペンタノン、シクロヘキサノン、2,6-ジメチル シクロヘキサノン等のケトン類;メチルアルコール、エ チルアルコール、n-プロピルアルコール、i-プロピ ルアルコール、nーブチルアルコール、tーブチルアル コール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、 1,4-ヘキサンジオール、1,4-ヘキサンジメチロ ール等のアルコール類; テトラヒドロフラン、ジオキサ ン等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸 i-アミル等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳 香族炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、 ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これら の有機溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。有機溶剤の使用量は、アルカリ性水溶 液に対して、100容量%以下が好ましい。この場合、 有機溶剤の使用量が100容量%を超えると、現像性が 低下し、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。ま た、アルカリ性水溶液からなる現像液には、界面活性剤 等を適量添加することもできる。なお、アルカリ性水溶 液からなる現像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄 して乾燥する。

# [0121]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。こ こで、部および%は、特記しない限り重量基準である。 実施例および比較例における各測定・評価は、下記の要 領で行った。

Mw: 東ソー(株) 製GPCカラム(G2000HXL2

本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本)を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40 $^{\circ}$ の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した。

保存安定性:組成物溶液をシリコンウエハー上にスピン コートにより塗布し、140℃に保持したホットプレー ト上で90秒間PBを行って作製した膜厚1 μmのレジ スト被膜を、2.38%テトラメチルアンモニウムヒド ロキシド水溶液により、25℃で1分間現像し、水洗 し、乾燥したのち、膜厚を測定した。これを、初期残膜 厚とする。また、組成物溶液を50℃の恒温槽に保持 し、保持後の組成物溶液から毎日、前記と同様にしてレ ジスト被膜の作製、現像、水洗および乾燥を行ったの ち、保持後の残膜厚を測定した。このとき、初期残膜厚 に対する保持後の残膜厚の変化率が50%を超えるのに 要する日数を求めて、保存安定性の尺度とした。この日 数が大きいほど、保存安定性が良好であることを示す。 放射線透過率:組成物溶液を石英ガラス上にスピンコー トにより塗布し、90℃に保持したホットプレート上で 60秒間PBを行って作製した膜厚1μmのレジスト被 膜について、波長193nmにおける吸光度から、透過 率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とし

【0122】相対エッチング速度:組成物溶液をシリコ ンウエハ上にスピンコートした乾燥膜厚0.5μmのレ ジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッチング装置 (Pinnacle8000)を用い、エッチングガスをCF₄と し、ガス流量75sccm、圧力2.5mToor、出 力2500Wの条件でドライエッチングを行って、エッ チング速度を測定し、クレゾールノボラック樹脂からな る被膜のエッチング速度に対する相対値により、相対エ ッチング速度を評価した。相対エッチング速度の小さい ほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。 感度:基板として、表面に膜厚520ÅのDeepUV30 (ブルーワー・サイエンス (Brewer Science) 社製) 膜 を形成したシリコーンウエハー(ARC)を用い、組成 物溶液を基板上にスピンコートしたのち、ホットプレー ト上で、表2に示す条件にてPBを行って、膜厚0.4 μmのレジスト被膜を作製した。このレジスト被膜に、 (株) ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(レン ズ開口数0.55、露光波長193nm)により、マス クパターンを介して露光した。次いで、ホットプレート 上で、表2に示す条件にてPEBを行ったのち、2.3 8%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液(実 施例1~16) または2.38×1/50%テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド水溶液(比較例1)によ り、25℃で1分間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型 レジストパターンを形成した。その際、線幅 $0.18\mu$ mのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)を

1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この 最適露光量を感度とした。

解像度:最適露光量で露光したときに解像される最小の レジストパターンの寸法を解像度とした。

パターン形状:線幅 $0.20\mu$ mのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺寸法 $L_1$ と上辺寸法 $L_2$ とを走査型電子顕微鏡により測定し、 $0.85 \le L_2 / L_1 \le 1$ を満足し、かつパターン形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良好"であるとし、これらの条件の少なくとも一つを満たさない場合を、パターン形状が"不良"であるとした。

# 【0123】合成例1

還流管を装着したセパラブルフラスコに、窒素気流下で、3-ヒドロキシー1-アダマンチルメタクリレート27部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート

13部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へプト-2-エン40部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を仕込み、65℃で5時間重合した。重合終了後、反応溶液を大量のn-ヘキサン/i-プロピルアルコール(重量比=3/1)混合溶媒中に注いで、樹脂を凝固させ、凝固した樹脂を同じ混合溶媒で数回洗浄したのち、真空乾燥して、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A1-I)20モル%、(A1-II)10モル%、(A1-II)35モル%であり、Mwが12,000の共重合体を収率60%で得た。この共重合体を、共重合体(A-1)とする。

【0124】 【化56】

$$CH_3$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 
 $COC(CH_3)_3$ 

# 【0125】合成例2

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート40部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[ $4.4.0.1^{2+5}.1^{7+10}$ ]ドデカ-3-エン35部、無水マレイン酸15部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部

を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A2-I)40モル%、(A2-II) 10モル%、(A2-III) 25モル%、(A2-IV) 25モル%であり、Mwが8, 000の共重合体を収率62%で得た。この共重合体を、共重合体(A-2)とする。

【0126】 【化57】

# 【0127】合成例3

仕込み原料として、2-(5'-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]へプチル)アクリレート25部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート15部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へプト-2-エン40部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部

を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A3-I)20モル%、(A3-II)10モル%、(A3-III)35モル%、(A3-IV)35モル%であり、Mwが13、000の共重合体を収率70%で得た。この共重合体を、共重合体(A-3)とする。

[0128]

【化58】

# 【0129】合成例4

仕込み原料として、2-(5'-E)ドロキシビシクロ[2.2.1]へプチル)アクリレート40部、2-メチルー2-アダマンチルメタクリレート10部、8-tーブトキシカルボニルテトラシクロ[ $4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}$ ]ドデカー3-エン35部、無水マレイン酸15部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1

と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が (A4-I) 40モル%、(A4-II)10モル%、(A4-III)25モル%、(A4-IV)25モル%であり、Mwが10,00の共重合体を収率64%で得た。この共重合体を、共重合体(A-4)とする。

【0130】 【化59】

## 【0131】合成例5

仕込み原料として、3-(8'-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1²,5.17,10]ドデシル)アクリレート30部、2-メチル-2-アダマンチルアクリレート12部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン38部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様に

して、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A5-I) 2 0モル%、(A5-II)10モル%、(A5-III)35モル%、 (A5-IV)35モル%であり、Mwが12,000の共重 合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体 (A-5)とする。

【0132】 【化60】

## 【0133】合成例6

仕込み原料として、3-(8'-)ヒドロキシテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデシル)アクリレート50部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデカ-3-エン30部、無水マレイン酸10部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以

外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A6-I)40モル%、(A6-II)10モル%、(A6-II)25モル%であり、Mwが8,000の共重合体を収率58%で得た。この共重合体を、共重合体(A-6)とする。

[0134]

【化61】

(A6-II) (A6-II)

# 【0135】合成例7

仕込み原料として、3-(8'-1) ートドロキシテトラシクロ $[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]$  ドデシル)アクリレート50部、2-1 エチルー2-1 アグマンチルアクリレート10部、10 8ーtーブトキシカルボニルテトラシクロ $[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]$  ドデカー10 3ーエン10 3ーエン

(A6-III) (A6-IV)

外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A7-I)40モル%、(A7-II)10モル%、(A7-II)25モル%、(A7-IV)25モル%であり、Mwが8,000の共重合体を収率58%で得た。この共重合体を、共重合体(A-7)とする。

【0136】 【化62】

(A7-II)

## 【0137】合成例8

仕込み原料として、4ーオキソー1ーアダマンチルアクリレート27部、2ーメチルー2ーアダマンチルメタクリレート13部、5ーtーブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へプトー2ーエン40部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と

(A7-I)

同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A8-I) 20モル%、(A8-II) 10モル%、(A8-III) 35モル%、(A8-IV) 35モル%であり、Mwが12,000の共重合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体(A-8)とする。

(A7-IV)

【0138】

(A7-III)

【化63】

# 【0139】合成例9

仕込み原料として、3-(8'-)ヒドロキシテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデシル)アクリレート30部、(1-)アグマンチル-1-メチルエチル)アクリレート16部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン38部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例

1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が (A9-I) 20モル%、(A9-II)10モル%、(A9-III)35モル%、(A9-IV)35モル%であり、Mwが12,00の共重合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体(A-9)とする。

【0140】 【化64】

(A9-II)

# 【0141】合成例10

仕込み原料として、3-(8'-1) ートドロキシテトラシクロ[4.4.0. $1^{2,5}$ . $1^{7,10}$ ] ドデシル) アクリレート50部、2-3 チルー2-1 アグマンチルメタクリレート35部、3-1 アグビスイソブチロニトリル5部およびテトラヒドロフラン100 部を用いた以外は、合成例1 と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A10-II)1 0-I)1 0-I)1 0-I)1 0-I)1 0-I)1 0-I)1 0-I)1 0-II)1 0-III)1 0-III)1

(A9-I)

【化65】

(A10-II) (A10-III)

【0143】合成例11

任込み原料として、3-ヒドロキシー1-アダマンチルアクリレート25部、4-ヒドロキシシクロヘキシルアクリレート50部、2-メチルー2-アダマンチルメタクリレート25部、アゾビスイソブチロニトリル5部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率

が (A11-I) 2 0 モル% 、(A11-II) 6 0 モル% 、 (A11-II I) 2 0 モル%であり、Mwが9,000の共重合体を収率6 7 %で得た。この共重合体を、共重合体 (A-11) とする。

## [0144]

# 【化66】

## 【0145】合成例12

任込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート30部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート45部、 $\alpha-$ メタクリロイルオキシ $-\gamma-$ ブチロラクトン25部、アゾビスイソブチロニトリル5部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が (A12-II)30モル%、(A12-III)30モル%であり、Mwが8,500の共重合体を収率70%で得た。この共重合体を、共重合体 (A-12)とする。

[0146]

【化67】

## 【0147】合成例13

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート30部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート45部、 $\beta-$ アクリロイルオキシ-  $\gamma-$  ブチロラクトン25部、アゾビスイソブチロニトリル5 部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含

有率が(A13-I)30モル%、(A13-II)40モル%、(A13-III)30モル%であり、Mwが8,900の共重合体を収率72%で得た。この共重合体を、共重合体(A-13)とする。

[0148]

【化68】

# 【0149】比較重合例1

アクリル酸テトラヒドロピラニル18.28部、アクリル酸トリシクロデカニル25部、アゾイソブチロニトリル0.2部およびtードデシルメルカプタン0.1部を1,2-ジエトキシエタン100部に溶解し、65℃で5時間重合した。重合終了後、反応溶液を大量のメチル

アルコール中に注いで、樹脂を凝固させ、凝固した樹脂を減圧乾燥して、アクリル酸テトラヒドロピラニルおよびアクリル酸トリシクロデカニルの各含有率がともに50モル%であり、Mwが20,000の共重合体を収率35%で得た。この共重合体を、樹脂(a-1)とする。

[0150]

# 【実施例】実施例1~18、比較例1

表1に示す成分を混合して均一溶液としたのち、孔径 0.2 μmのメンブランフィルターでろ過して、各組成物溶液を調製し、各種評価を行った。評価結果を、表3に示す。各実施例および比較例中の樹脂以外の成分は、下記のとおりである。酸発生剤(B)

B-1: トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

B-2: トリフェニルスルホニウムノナフルオローn - ブタンスルホネート

B-3: 4-n-7トキシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネートB-4: ビス (4-t- ブチルフェニル) ヨードニウムノ

ナフルオローnーブタンスルホネート

B-5:トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド酸拡散制御剤

C-1: トリーnーオクチルアミン

C-2: メチルジシクロヘキシルアミン

C-3:1-(2'-ヒドロキシエチル) ピペラジン

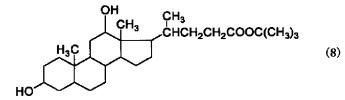
C-4:4-ヒドロキシキノリン

# 他の添加剤

D-1: デオキシコール酸t - ブチル (下記式 (8) 参照)

[0151]

【化69】



【0152】D-2:1,3-アダマンタンジカルボン酸

ジーセーブチル溶剤

E-1: 2-ヘプタノン

E-2: 2-ヒドロキシプロピオン酸エチル

E-3: プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ

**−** ⊦

E-4:3-エトキシプロピオン酸エチル

E-5:シクロヘキサノン

[0153]

【表1】

\_表\_1\_

	樹脂	酸発生剤 (B) (部)	酸拡散制御剤(部)	他の添加剤 (部)	溶剤
実施例1	A-1 ( 95)	B-2 (1, 5)	C-2 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (480)
実施例2	A-1 (100)	B-1 (1,5)	C-1 (0.03)		E-1 (480)
実施例3	A-2 (95)	B-1 (1, 5)	C-2 (0, 03)	D-1 (5)	E-2 (480)
実施例4	A-2 (95)	B-1 (0, 5) B-2 (1, 0)	C-1 (0, 01) C-4 (0, 01)	D-1 (5)	E-2 (420) E-4 (100)
実施例 5	A-3 (100)	B-2 (1, 5)	C-3 (0, 03)		E-3 (480)
実施例 6	A-3 (95)	B-3 (1, 5) B-5 (0, 5)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (480)
実施例7	A-4 ( 95)	B-3 (1, 5)	C-4 (0, 03)	D-1 (5)	E-2 (420) E-4 (100)
実施例8	A-4 ( 95)	B-2 (1, 0) B-3 (1, 0)	C-2 (0, 03)	D-2 (5)	E-1 (480)
実施例9	A-5 (95)	B-4 (1.5)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (530)
実施例10	A-5 (95)	B-2 (1, 5)	C-2 (0, 03)	D-2 (5)	E-1 (530)
実施例11	A-6 (100)	B-1 (1.5) B-5 (0.3)	C-1 (0, 03)		E-1 (530)
実施例12	A-7 ( 95)	B-2 (1, 5) B-5 (0, 3)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (300) E-3 (150)
実施例13	A-8 (95)	B-1 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (480)
実施例14	A-9 (90)	B-2 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-1 (10)	E-1 (450)
実施例15	A-10( 90)	B-4 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-2 (10)	E-1 (410)
実施例16	A-11( 90)	B-4 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-2 (10)	E-1 (410)
実施例17	A-12( 90)	B-2 (2, 0)	C-3 (0.04)	D-1 (10)	E-1 (400) E-5 (100)
実施例18	A-13( 90)	B-2 (2, 0)	C-3 (0, 04)	D-1 (10)	E-1 (400) E-5 (100)
比較例1	a-1 (100)	B-1 (1.5)	C-1 (0.03)		E-1 (530)

【0154】 【表2】

表 2

	レジスト被膜	基板の種類	РВ		PEB		
	の膜厚(μm)		温度 (℃)	時間 (秒)	温度 (°C)	時間 (秒)	
実施例 1	0, 4	ARC	140	90	140	90	
実施例2	0.4	ARC	140	90	140	90	
実施例3	0.4	ARC	130	90	140	90	
実施例4	0.4	ARC	130	90	140	90	
実施例5	0.4	ARC	130	90	130	90	
実施例6	0.4	ARC	140	90	140	90	
実施例7	0.4	ARC	130	90	130	90	
実施例8	0.4	ARC	130	90	140	90	
実施例9	0.4	ARC	140	90	140	90	
実施例10	0, 4	ARC	140	90	140	90	
実施例11	0. 4	ARC	140	90	140	90	
実施例12	0. 4	ARC	140	90	140	90	
実施例13	0. 4	ARC	140	90	140	90	
実施例14	0. 4	ARC	140	90	140	90	
実施例15	0, 4	ARC	130	90	140	90	
実施例16	0, 4	ARC	130	90	140	90	
実施例17	0.4	ARC	130	90	130	90	
実施例18	0.4	ARC	130	90	130	90	
比較例1	0, 4	ARC	140	90	140	90	

【0155】

【表3】

3

	保存安定性	放射線透過率 (193mm, %)	相対エッチング 連度	感度 (mJ/cm²)	解像度 (μm)	パターン 形状	
実施例1	60日以上	65	1, 4	16	0, 15	良好	
実施例2	60日以上	63	1.5	15	0, 15	良好	
実施例3	60日以上	67	1, 3	17	0. 15	良好	
実施例4	60日以上	66	1, 3	17	0, 15	良好	
実施例 5	60日以上	62	1, 6	15	0, 15	良好	
実施例 6	60日以上	64	1. 6	15	0, 15	良好	
実施例7	60日以上	64	1. 4	16	0, 15	良好	
実施例8	60日以上	64	1. 4	17	0, 15	良好	
実施例 9	60日以上	62	1, 6	15	0. 15	良好	
実施例10	60日以上	62	1, 5	17	0.15	良好	
実施例11	60日以上	65	1. 2	16	0, 15	良好	
実施例12	60日以上	65	1.2	16	0, 15	良好	
実施例13	60日以上	63	1, 5	17	0.15	良好	
実施例14	60日以上	64	1.4	18	0, 15	良好	
実施例15	60日以上	70	1.4	16	0, 15	良好	
実施例16	60日以上	70	1, 5	15	0.15	良好	
実施例17	60日以上	71	1, 5	13	0, 15	良好	
実施例18	60日以上	71	1, 5	14	0, 15	良好	
比較例1	10日	70	2, 5	13	0. 25	不良	

増幅型レジストとして、組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジス

トとしての基本物性に優れており、今後さらに微細化が 進行すると予想される半導体デバイスの製造に極めて好 適に使用することができる。

# フロントページの続き

(72)発明者 梶田 徹

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

(72)発明者 下川 努

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AC04

ACO5 ACO6 ACO8 ADO3 BEO0

BG00 FA03 FA12 FA17

4J002 BG041 BG051 BG071 BK001

EB006 EB126 EQ016 EU046

EU186 EV216 EV246 EV266

EV296 EV306 EW176 EY006

FD206 GP03